



<b>Prüfbericht-Nr.:</b> <i>Test report no.:</i>	<b>19632281 001</b> <b>ULR:TC56882140000529F</b>	<b>Auftrags-Nr.:</b> <i>Order no.:</i>	146617004	Seite 1 von 21 Page 1 of 21
<b>Kunden-Referenz-Nr.:</b> <i>Client reference no.:</i>	2379116	<b>Auftragsdatum:</b> <i>Order date:</i>	24/10/2021	
<b>Auftraggeber:</b> <i>Client:</i>	Mundra Solar Energy Limited. Survey No. 180/P, APSEZ, Village Tunda, Mundra, Kachchh, Gujarat, 370435, India			
<b>Prüfgegenstand:</b> <i>Test item:</i>	Photovoltaic (PV) modules			
<b>Bezeichnung / Typ-Nr.:</b> <i>Identification / Type no.:</i>	ASM-M10-144-540			
<b>Auftrags-Inhalt:</b> <i>Order content:</i>	Testing against PID resistivity			
<b>Prüfgrundlage:</b> <i>Test specification:</i>	Solar Photovoltaic Modules IEC TS 62804-1:Test methods for the detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline silicon with following severities - Climatic conditions: 85°C and 85% RH - Duration: One cycle of 96 hours			
<b>Wareneingangsdatum:</b> <i>Date of sample receipt:</i>	29/10/2021	<p style="text-align: center;">Detaillierte Fotodokumentation siehe Anlage zu diesem Bericht</p> <p style="text-align: center;">Detailed photo documentation see appendix to this report</p>		
<b>Prüfmuster-Nr.:</b> <i>Test sample no.:</i>	Refer list of test samples			
<b>Prüfzeitraum:</b> <i>Testing period:</i>	10/11/2021 –09/12/2021			
<b>Ort der Prüfung:</b> <i>Place of testing:</i>	#27/B, 2nd Cross Road, Electronics City Phase-1, 560100, Bengaluru, India			
<b>Prüflaboratorium:</b> <i>Testing laboratory:</i>	TUV Rheinland(India) Pvt. Ltd.,Bangalore,India			
<b>Prüfergebnis*:</b> <i>Test result*:</i>	Pass			
<b>geprüft von:</b> <i>tested by:</i> Nishwin Pal		<b>genehmigt von:</b> <i>authorized by:</i> Purushothama A.		
<b>Datum:</b> <i>Date:</i> 24/12/2021		<b>Ausstellungsdatum:</b> <i>Issue date:</i> 24/12/2021		
<b>Stellung / Position:</b>	Engineer-Products(S&C)	<b>Stellung / Position:</b>	Manager-Products(S&C)	
<b>Sonstiges /</b> <i>Other:</i>				
<b>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</b> <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet				
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
<p style="text-align: center;"><b>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</b> <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>				

v05